

走査型プローブ顕微鏡（Bruker Nano 社製 NanoScopeV 型コントローラー搭載マルチモード 8JSPM システム）

製造元	Bruker Nano Inc.
仕様	最大走査範囲 x:125 μ m, y: 125 μ m, z:5 μ m
保有部署	材料化学専攻 無機構造化学分野
設置場所	桂・A2棟・化学系 コアラボ
利用期間・時間、 利用料金	本設備の共同利用規程を参照 https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/f6rs2o.pdf
注意事項等	
連絡先	材料化学専攻 無機構造化学分野 助教 清水雅弘 075-383-2463 shimizu.masahiro.3m (at) kyoto-u.ac.jp http://func.mc.kyoto-u.ac.jp/
キーワード	表面形状測定、表面物性測定
機器コード	(KUMaCo 稼働開始後、追記します)
自由記入欄	鋭利な探針で試料表面を走査し、微小領域における表面形状や物性の測定が可能

